

Вимірювання для глобальної торгівлі

Реліз:

20 травня відзначається Всесвітній день метрології, присвячений річниці підписання Метричної конвенції у 1875 році. Цей договір є фундаментом узгодженої системи вимірювань у всьому світі, яка лежить в основі наукових відкриттів та інновацій, промислового виробництва та міжнародної торгівлі, а також поліпшення якості життя та захисту всесвітнього навколишнього середовища.

Темою Всесвітнього дня метрології у 2020 р. є **«Вимірювання для глобальної торгівлі»**. Цю тему було обрано для забезпечення обізнаності щодо важливої ролі, яку відіграють вимірювання у сприянні справедливій глобальній торгівлі, забезпеченні відповідності продукції стандартам та нормам, а також задоволенні очікувань клієнтів щодо якості.

Національні метрологічні інститути по всьому світу розвивають метрологічну науку, розробляючи та підтверджуючи нові методи вимірювань будь-якого необхідного рівня прецизійності. Національні метрологічні інститути також беруть участь у звіреннях, які координуються *Міжнародним бюро з мір та ваг (BIPM)*, для забезпечення надійності результатів вимірювань у всьому світі.

Міжнародна організація із законодавчої метрології (OIML) розробляє міжнародні Рекомендації, метою яких є узгодження та гармонізація вимог у багатьох галузях у всьому світі. OIML також має Систему сертифікації (OIML-CS), що сприяє міжнародному визнанню та глобальній торгівлі законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки.

Ці міжнародні метрологічні системи гарантують необхідне забезпечення і впевненість у точності вимірювань, утворюючи надійну основу для глобальної торгівлі на сьогодні та допомагаючи нам підготуватися до викликів майбутнього.

У Всесвітній день метрології відзначається внесок людей, які упродовж року наполегливо працюють у міжурядових і національних метрологічних організаціях та інститутах.

Із додатковою інформацією, у тому числі з посланням від директорів, постерами та переліком подій, можна ознайомитися на сайті

www.worldmetrologyday.org

Контактна електронна адреса: wmd@worldmetrologyday.org